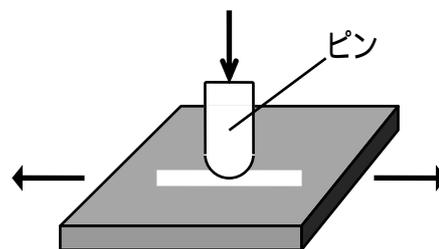


テナック-C HC460、HC760 の光ディスクへの傷付き性

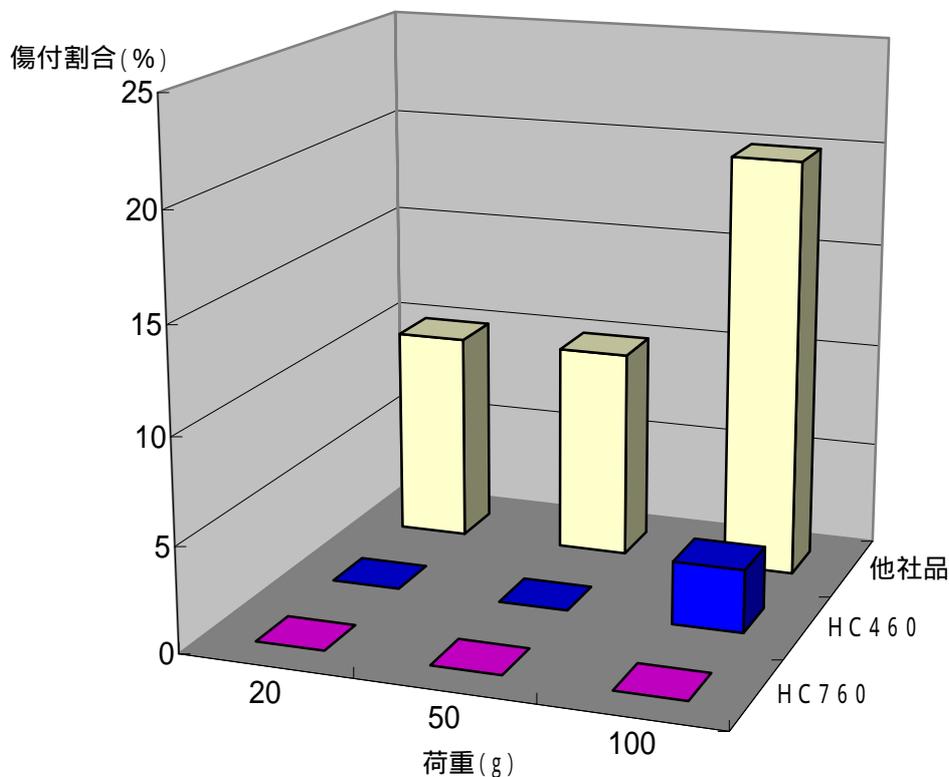
テナック-C HC460、HC760は、光ディスクへの傷つき防止を目的として設計・開発されたグレードです。以下にその特性を示します。

1. 試験方法 点接触・往復動摩擦摩耗試験:ピン/プレート

ピン	:テナック-C HC460、HC760、他社品(先端直径5 mm 球面)
プレート	:光ディスク(CD-R)
荷重	:20, 50, 100 g
速度	:50 mm/sec
往復距離	:20 mm
往復回数	:100回
測定温度	:23



2. 試験結果



テナック-C HC760 の摺動性(対POM)

1. 試験方法 点接触・往復動摩擦摩耗試験:ピン/プレート

ピン :テナック-C HC450(先端直径5 mm 球面)

プレート :テナック-C HC460、HC760、HC450

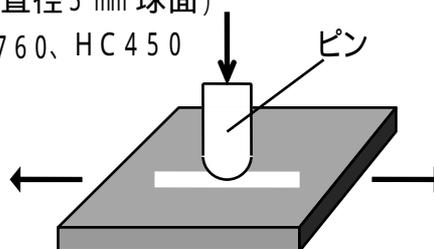
荷重 :2 kgf

速度 :30 mm / sec

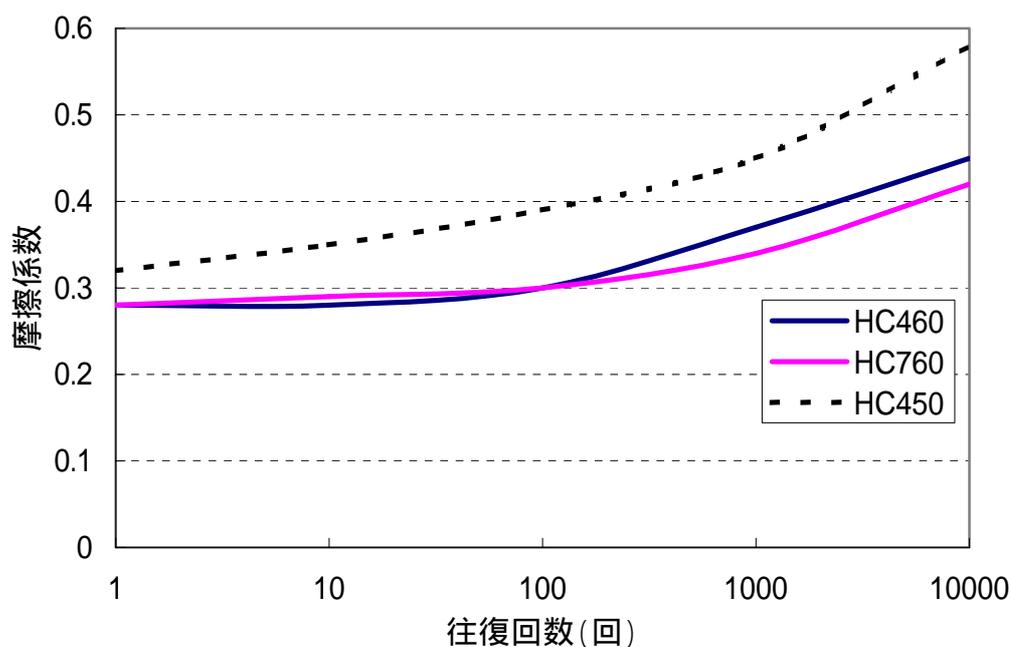
往復距離 :20 mm

往復回数 :10000回

測定温度 :23



2. 摩擦特性



3. 摩耗特性

	プレート摩耗量(μm)	ピン接触円変化量(mm)
HC460	130	1.0
HC760	160	1.0
HC450	450	1.2

テナック-C HC760流動特性

1. 試験方法 スパイラルフロー
成形機 : 住友重機械 SGM125
流路 : 5 × 1mm
樹脂温度: 200
金型温度: 60

2. 流動特性

